### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-032428

(43)Date of publication of application: 09.02.1993

(51)Int.Cl.

CO3B 33/09 B23K 26/00

B26F 3/06

(21)Application number: 03-190115

(71)Applicant: HOYA CORP

(22)Date of filing:

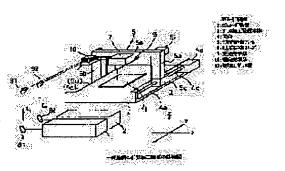
30.07.1991

(72)Inventor: FUKATSU TORU

### (54) METHOD FOR WORKING GLASS AND ITS APPARATUS

### (57) Abstract:

PURPOSE: To provide a method for working glass in which a glass body to be worked can readily and rapidly be split into a complicated shape while suppressing occurrence of dust, etc., and its apparatus. CONSTITUTION: A method for working glass of this invention and its apparatus are as follows. A laser beam (L1) within an ultraviolet light region having high absorptivity for a glass body 11 to be worked is concentrated on a surface part of the glass body 11 to be worked and its concentrated point is scanned along the shape of the purpose of working. Thereby, scribing is carried out on the surface part of the glass body 11 to be worked and the aforementioned glass body to be worked is then irradiated with a laser beam (L2) having a higher absorptivity for the aforementioned glass body 11 to be worked along a site where the scribing is carried out to apply a thermal strain related to the splitting to the above-mentioned site. As the result of the splitting, the glass body to be worked can readily and rapidly be



split into a complicated shape while suppressing occurrence of dust, etc.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

14.04.1998

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3036906

[Date of registration]

25.02.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection] [Date of extinction of right]

25.02.2006

### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平5-32428

(43)公開日 平成5年(1993)2月9日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C 0 3 B 33/09		9041-4G		
B 2 3 K 26/00	320 E	7920-4E		
R26F 3/06		7411 - 3 C		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 8 頁)

		<del>,</del>	
(21)出願番号	特顧平3-190115	(71)出願人	000113263
			ホーヤ株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)7月30日		東京都新宿区中落合2丁目7番5号
		(72)発明者	深津 透
			東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホー
			ヤ株式会社内
		(74)代理人	弁理士 阿仁屋 節雄 (外2名)

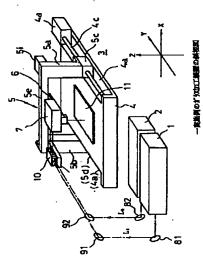
### (54) 【発明の名称】 ガラス加工方法及びその装置

### (57)【要約】

【目的】 被加工ガラス体を、塵等の発生を押さえつつ 容易・迅速に複雑な形状に割断できるガラス加工方法及 びその装置を提供することを目的としたものである。

【構成】 本発明にかかるガラス加工方法及びその装置は、被加工ガラス体11に対して高い吸収率を有する紫外線領域のレーザ光L1を被加工ガラス体11の表面部に集光してその集光点を加工目的の形状に沿って走査させることにより、該被加工ガラス体11の表面部にスクライビングを施した後、このスクライビングを施した部位に沿って前配被加工ガラス体11に対して高い吸収率を有する赤外線領域のレーザ光L2を照射して該部位に割断に結び付く熱歪みを与えることにより割断するようにしたもので、これにより、被加工ガラス体を、塵等の発生を押さえつつ容易・迅速に複雑な形状に割断することを可能にしたものである。





1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被加工ガラス体の表面部にスクライビングを施してこのスクライビングを施した部位に沿って被加工ガラス体に歪を与え、該部位から被加工ガラス体を割断するガラス加工方法において、

前記被加工ガラス体に対して高い吸収率を有する紫外線 領域のレーザ光を被加工ガラス体の表面部に集光してそ の集光点を加工目的の形状に沿って走査させることによ り、該被加工ガラス体の表面部にスクライビングを施す 工程と、

このスクライビングを施した部位に沿って前記被加工ガラス体に対して高い吸収率を有する赤外線領域のレーザ光を照射して該部位に割断に結び付く熱歪みを与える工程とを含むことを特徴としたガラス加工方法。

【請求項2】 請求項1に記載のガラス加工方法において、

前記紫外線領域のレーザ光として、エキシマレーザ光、またはパルスNd: YAGレーザの第3高調波光もしくは第4高調波光を用い、前記赤外線領域のレーザ光としてCO: レーザ光を用いることを特徴としたガラス加工 20方法。

【請求項3】 請求項1または2に記載のガラス加工方法を実施するガラス加工装置であって、

前記被加工ガラス体に対して高い吸収率を有する紫外線 領域のレーザ光を発生する第1レーザ装置と、

前記被加工ガラス体に対して高い吸収率を有する赤外線 領域のレーザ光を発生する第2レーザ装置と、

前記第1レーザ装置から射出された紫外線領域のレーザ 光を集光する第1集光手段と、

前記第2レーザ装置から射出された赤外線領域のレーザ 30 光を集光する第2集光手段と、

前記第1集光手段によって集光された紫外線領域のレーザ光を前記被加工ガラス体上を加工目的の形状に沿って 走査させてスクライビングを施す第1走査手段と、

前記第2集光手段によって集光された赤外線領域のレーザ光を前記スクライビングを施した部位に沿って走査させる第2走査手段とを有することを特徴としたガラス加工装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、例えば、LCD基板用の高品位薄板ガラス等を迅速にかつ正確に所望の形状に沿って割断加工する場合等に利用できるガラス加工方法及びその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】板ガラス等のガラス体を切断するには、 ダイヤモンド工具や超硬工具等によりガラスに切れ込み を入れ(スクライビング)、その切れ込みに沿って機械 的な応力を加えて割る(割断)という方法が一般的であ った。 【0003】また、この場合、機械的応力を加える代わりに、切れ込み(スクライブ線)に沿ってCO2 レーザ光を照射し、該部位に熱歪を加えて割断するという方法も提案されていた(実開昭62-175042 号公報参照)。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、近年、多用されるようになったLCD基板用の高品位薄板ガラス等を所望の複雑な形状に沿って正確に切断するような場合、上述の従来の方法では次のような問題が生じていた。

【0005】すなわち、ダイヤモンド工具や超硬工具等により機械的にスクライビングを施す場合、スクライブ線の形状が曲線のような場合には、このスクライブ線から離れた方向への割れ(クラック)が入りやすいため、曲線を含む複雑な形状の切断が困難であり、歩留まりも悪いという問題があった。

【0006】また、機械的にスクライピングを行う際と機械的応力を加えて割断する際に、削り屑や微細な欠け 屑等の塵が発生し易く、この塵が最終製品の歩留まりを 7 下げる一因ともなるという問題もあった。

【0007】この発明は、上述の背景のもとでなされたものであり、被加工ガラス体を、塵等の発生を押さえつつ容易・迅速に複雑な形状に割断できるガラス加工方法及びその装置を提供することを目的としたものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた めに本発明は、(1) 被加工ガラス体の表面部にスク ライピングを施してこのスクライピングを施した部位に 沿って被加工ガラス体に歪を与え、該部位から被加工ガ ラス体を割断するガラス加工方法において、前配被加工 ガラス体に対して高い吸収率を有する紫外線領域のレー ザ光を被加工ガラス体の表面部に集光してその集光点を 加工目的の形状に沿って走査させることにより、該被加 エガラス体の表面部にスクライビングを施す工程と、こ のスクライピングを施した部位に沿って前記被加工ガラ ス体に対して高い吸収率を有する赤外線領域のレーザ光 を照射して該部位に割断に結び付く熱歪みを与える工程 とを含むことを特徴とした構成とし、この構成1の態様 構成1のガラス加工方法において、前 として、(2) 記紫外線領域のレーザ光として、エキシマレーザ光、ま たはパルスNd: YAGレーザの第3高調波光もしくは 第4高調波光を用い、前記赤外線領域のレーザ光として CO』レーザ光を用いることを特徴とした構成とし、ま た、構成1または2の方法を実施するガラス加工装置と して、(3) 構成1または2のガラス加工方法を実施 するガラス加工装置であって、前記被加工ガラス体に対 して高い吸収率を有する紫外線領域のレーザ光を発生す る第1レーザ装置と、前記被加工ガラス体に対して高い 吸収率を有する赤外線領域のレーザ光を発生する第2レ 50 一ザ装置と、前記第1レーザ装置から射出された紫外線

-184-

3

領域のレーザ光を集光する第1集光手段と、前記第2レ ーザ装置から射出された赤外線領域のレーザ光を集光す る第2集光手段と、前記第1集光手段によって集光され た紫外線領域のレーザ光を前記被加工ガラス体上を加工 目的の形状に沿って走査させてスクライビングを施す第 1走査手段と、前記第2集光手段によって集光された赤 外線領域のレーザ光を前記スクライビングを施した部位 に沿って走査させる第2走査手段とを有することを特徴 とした構成としたものである。

[0009]

【作用】上述の構成1において、被加工ガラス体に対し **て高い吸収率を有する紫外線領域のレーザ光を被加工ガ** ラス体の表面部に集光してその集光点を加工目的の形状 に沿って走査させることにより、該被加工ガラス体の表 面部に良好なスクライビングを施すことができる。この 点は本発明者が見出だしたもので、従来は、ガラス体に レーザスクライビングを施すのは極めて困難とされてい た。これに対して、本発明者は紫外線領域のレーザ光を 用いることにより、良好なスクライビングを施すことが できることを見出だしたものである。

【0010】すなわち、紫外線領域のレーザ光は、通常 のガラス材に対する吸収率が著しく高いので、ガラス体 に照射した場合、ガラス体の極表面でのみ吸収される。 従って所定以上の強度を有する紫外線領域のレーザ光を 集光してガラス体の表面に照射することにより、ガラス 体の極表面部、すなわち、数μm内外の深さの範囲内に レーザ光のエネルギーを集中して吸収させることができ る。そして、集光スポット径を適切に設定することによ り、現在、実用的に得られる紫外線領域のレーザ光を用 ギー密度をガラス体を蒸発・飛散させる程度まで高める ことができることを見出だした。以下、この作用を説明 する。

【0011】いま、ガラス体の吸収係数をα(c m-1)、レーザ光が1/100に減衰するまでの深さを t (cm) とすると、

 $e^{-at} = 0.01 \cdots (1)$ 

であるから、この(1) 式より、

t=4.  $61/\alpha$  ···(2)

である。

【0012】また、レーザ光のピーム径をd(cm)と すると、レーザ光が吸収される体積V(cm³)は、

 $V = (d/2)^2 \pi t \cdots (3)$ 

である。ここで、レーザ光がこの体積V内で均一に吸収 されると仮定する。そして、このときの吸収エネルギー をE(J)とし、また、ガラス体の密度を $\rho$ (g/cm³)、比熱をC(J/g・K)、温度上昇をT(K)と すると、

 $E = C \rho V T \cdots (4)$ 

である。この(4) 式から、

 $T = E/C \rho V \cdots (5)$ 

となる。この(5) 式に上記(2) 式及び(3) 式を代入する

 $T = (\alpha E) / \{4. 61 \pi \rho C (d/2)^{2}\} \cdots$ (6)

となる。この(6) 式に、通常のガラス体に対する紫外線 領域のレーザ光の吸収係数や現在実用的に発生できる紫 外線領域のレーザ光パワー等の典型値として、下記値を 入れる。

10  $[0013] \alpha = 10000$ 

 $d=0.003 cm (30 \mu m)$ 

C=0.2 cal/g·K

 $\rho = 2$ . 3 g/c m<sup>3</sup>

 $E=0.0001J(100\mu J)$ 

これにより、T=6700Kと求まる。この温度は、ガ ラス体の昇華点を十分に越えている。なお、ここでは、 パルス幅が十分に短い(10ns程度)パルスレーザを 用い、かつ、熱伝導等による熱の散逸がないと仮定した ものであるが、これは、現在実用的に得られる構成2に 20 かかげたような紫外線領域のレーザにおいても無理のな い仮定である。また、パルスレーザを用いた場合には、 加工形状に沿って照射位置をずらしながら各位置でパル スレーザ光を照射するようにすることで加工形状に沿っ たスクライビングを施すことができる。

【0014】さて、このようにして、被加工ガラス体の 表面に幅数十 $\mu$ m、深さ数 $\mu$ mのススクライビングを施 した工程の後に、このスクライビングを施した部位に沿 って構成2にかかげたCO』レーザのような赤外線領域 のレーザ光を照射して割断に結び付く熱歪を与えること いても、ガラス体表面部に集中させたレーザ光のエネル 30 により、被加工ガラス体をスクライビングの形状の沿っ て割断させることができる。

> 【0015】この方法によれば、レーザ光によるスクラ イビングであるので、曲線を含む複雑な形状でも、他の 部位にクラック等を入れることなく正確に、かつ、容易 ・迅速にスクライピングを施すことができ、しかも、そ のスクライビングの際には、ガラス体を昇華させ、蒸発 ・飛散させるので、削り屑のような、後の製造工程等で 障害となる可能性のある塵等を発生させることがない。 加えて、熱歪を加える工程も、赤外線領域のレーザ光を 40 照射することにより行うので、スクライビングを施した 部位に正確に沿って熱歪を加えることができ、他の部位 に有害な応力等が加わることがない。従って、割断の際 に割れや欠け等を生ずるおそれがなく、高い歩留まりで 割断を行うことができる。

【0016】さらに、構成3によれば、構成1または2 の方法を容易に実施できる装置を得ることができる。

[0017]

【実施例】図1はこの発明の一実施例にかかるガラス加 工装置の斜視図、図2は集光光学系の縦(Y2平面で切 50 断した) 断面図、図3は集光光学系の横(X2平面で切

断した) 断面図、図4は偏向光学系の水平(XY平面で 切断した図)、図5は一実施例のガラス加工方法の工程 説明図である。以下、これらの図面を参照にしながら、 まず、この発明の一実施例にかかるガラス加工装置を説 明し、次に、この発明にかかるガラス加工方法を説明す る。

### 【0018】一実施例のガラス加工装置

図1において、符号1は紫外線領域(UV)レーザ装 置、符号2はCO2 レーザ装置、符号3はガラス加工装 置本体である。

【0019】UVレーザ装置1は、Nd:YAGレーザ の第4高調波(波長:266nm)パルス光を発生して 射出するもので、内部にCW-QスイッチパルスNd: YAGレーザ装置と、このNd:YAGレーザ装置から 射出した基本波レーザ光を入射してその第4高調波光を 射出する高調波発生素子とを内蔵するものである。射出 されるパルス光のエネルギーは200μJ、パルスの繰 り返し周波数は5KHzである。

【0020】CO2 レーザ装置は、波長10.6 μmの レーザ光を連続して射出するもので、出力パワーは25 Wである。

【0021】ガラス加工装置本体3の概略構成は、基台 4と、この基台4に対して図中Y軸方向に移動可能なよ うに該基台に取り付けられたY方向走査フレーム5と、 このY方向走査フレーム5に対して図中X軸方向に移動 可能なように該Y方向走査フレーム5に取り付けられた X方向走査ステージ6と、このX方向走査ステージ6に 固定された集光光学系7とからなる。そして、前記UV レーザ装置1及びCO2 レーザ装置2からそれぞれ射出 されたUVレーザ光し、及び赤外レーザ光し」を、光路 変更用反射鏡81,82ならびに91,92をそれぞれ 介し、さらに、Y方向走査フレーム5に固定された偏向 光学系10を通じて集光光学系7に導き、該集光光学系 7によって集光した後、基台4上に固定された被加工ガ ラス板11に照射するようにしたものである。

【0022】 Y方向フレーム5は、略「門」形をなして おり、その両脚5a, 5bの下部にそれぞれスライダ5 c, 5d (スライダ5dは図示せず) を取り付け、これ らスライダ5 c, 5 dを、基台4の図中左右端部にそれ ぞれ形成したレール4 a, 4 b (レール4 b は図示せ ず) に摺動自在に嵌合したものである。そして、スライ ダ4aにガイドスクリュー4cを貫通螺合させ、このガ イドスクリュー4 cをパルスモータ4 dによって回転駆 動することにより、Y方向走査フレーム5をY軸方向に 移動制御するようにしたものである。なお、パルスモー タ4dは図示しない制御装置により制御されるようにな っている。

【0023】図2に示されるように、X方向走査ステー ジ6は、Y方向走査フレーム5の梁部5eの長手方向下 部に取り付けられたレール 5~f に摺動自在に嵌合されて 50~c を通じてX軸方向に沿って入射したレーザ光はそれぞ

おり、図中X軸方向に移動自在になっている。なお、こ のX方向走査ステージ6には腕5gが取り付けられてお り、この腕5gにはガイドスクリュー5hが貫通螺合さ れ、さらに、このガイドスクリュー5hはパルスモータ 5 i によって回転駆動されるようになっている。このパ ルスモータ51はY方向走査フレーム5に固定されてい ると共に、図示しない制御装置によって制御されるよう になっている。したがって、図示しない制御装置の制御 指令によってパルスモータ5 i を回転制御することによ 10 り、X方向走査ステージ6をX軸方向に移動制御するこ とができるようになっている。このX方向走査ステージ 6には集光光学系7が固定されている。

【0024】この集光光学系7はX方向走査ステージ6 に固定されたベース71と、このベース71の上側に固 定された2つの偏向ミラー72a, 72bと、ベース7 1の下側に取り付けられた2つの集光レンズ73a.7 3 bとを有している。

【0025】偏向ミラー72a, 72bはともにXY平 面に対して45°傾むけられ、かつ、互いにY軸方向に 所定の距離をおいて配置されているとともに、それぞ れ、あおり調整機構付きのミラーホルダー74a(図3 参照) 及び74b (図示せず) に取り付けられている。 偏向ミラー72a、72bは、それぞれ、ガラス等の基 板にUVレーザ光L:及びCO:レーザ光L:をほぼ1 00%反射する誘電体多層膜がコーティングされてい る。そして、ミラーホルダー74a及び74bはそれぞ れ支柱75a (図3参照) 及び75b (図示せず) を介 してペース71に固定されている。なお、偏向ミラー7 2a, 72bは、カパーケース71aに収納され、この カバーケース71aにはレーザ光入射窓71b (図3参 照)及び71c (図示せず)が設けられている。レーザ 光入射窓71b及び71cは、それぞれ偏向ミラー72 a. 72bの中心を通りX軸方向に平行な直線上に形成 されている。

[0026] 集光レンズ73a, 73bは、それぞれレ ンズホルダー76a,76bに保持され、また、このレ ンズホルダー76a, 76bは、それぞれ焦点調整機構 77a (図3参照) 及び77bを介してペース71に取 り付けられている。焦点調整機構77a及び77bは周 知のラックーピニオン機構等で構成されており、レンズ ホルダー76a, 76bを上下に移動調整することによ り、レーザ光の集光点を上下に調整できるようになって いる。さらに、偏向ミラー72a,72bの下部には、 ベース71を貫通してレーザ光射出窓78a, 78bが 形成されている。そして、これらレーザ光射出窓78 a, 78bとレンズホルダー76a, 76bとの間には 伸縮自在な蛇腹状のカバー管79a, 79bが設けられ

【0027】したがって、レーザ光入射窓71b,71

れ偏向ミラー74a.74bによって90°進路を変更 され、レーザ光射出窓78a、78bを通じて集光レン ズ73a, 73bに導かれ、これら集光レンズ73a, 73 bによって被加工ガラス板11に集光されるように なっている。そして、これら集光点は、上述のY方向走 査フレーム5及びX方向走査ステージ6を適宜移動させ ることにより目的とする加工形状に沿って走査させるこ とができるようになっている。なお、UVレーザ光Li の集光スポット径は30μm内外、CO2レーザ光の集 光スポット径は100μm内外である。また、被加工ガ 10 ラス板11は、低アルカリガラスの薄板(300×30 0×1mm) である。

【0028】また、図4に示されるように、偏向光学系 10は、反射鏡91、92によって反射されてきたUV レーザ光し、及びCO、レーザ光し、の進行方向を2つ の偏向ミラー101及び102によってそれぞれ90° 変更して集光光学系7に入射させるものでである。 偏向 ミラー101, 102はともにYZ平面に対して45° 傾むけられ、かつ、XY平面上においてY軸方向と45 ° なす方向に互いに所定の距離をおいて配置されている とともに、それぞれ、あおり調整機構付きのミラーホル ダー101a及び102aに取り付けられている。偏向 ミラー101, 102は、それぞれ、ガラス等の基板に UVレーザ光及びCO2 レーザ光をほぼ100%反射す る誘電体多層膜がコーティングされている。そして、ミ ラーホルダー101a及び102aは、それぞれ、図示 しない支柱を介してベース103に固定され、このベー ス103はY方向走査フレーム5に固定されている。な お、これら偏向ミラー101, 102は、カバーケース 104に収納され、このカパーケース104にはレーザ 光入射窓105a及び105b、ならびに、レーザ光射 出窓106a, 106bがそれぞれ設けられており、U Vレーザ光L1 及びCO2 レーザ光L2 はそれぞれこれ らの入・出射窓を通じて入・出射され、出射されたレー ザ光は上述のように、 集光光学系 7 に導入されて被加工 ガラス11に集光される。

【0029】なお、この一実施例の装置では、本発明に おける第1走査手段(UVレーザ光の走査手段)と、第 2走査手段(CO: レーザ光の走査手段)とを、1つの XY走査ステージによって兼ねるようにしているから、 比較的構造が単純であるという利点を有する。

【0030】一実施例のガラス加工方法

次に、上述のガラス加工装置を用いて本発明の一実施例 のガラス加工方法を実施する手順を説明する。

【0031】この一実施例の方法は、UVレーザ光L1 によるスクライビング工程と、このスクライビング工程 の次に行われるCO: レーザ光L: による割断の工程と からなる。

【0032】スクライビング工程は、UVレーザ光しい

ラス板11の極表面に集光させ(集光スポット径:約3 0μm)、集光点のガラス部材を蒸散させる(図5 (a) 参照)。図5 (a) において、矢印pは蒸散物を 示す。これと同時に、Y方向走査フレーム5及びX方向 走査ステージ6を適宜移動させることにより、UVレー ザ光L1 の集光点を、目的とする加工形状に沿って走査 させる。この場合、走査速度は、UVレーザ装置1のパ ルス発振の繰り返し周期(5KHz)を考慮にいれて、 各パルスによる蒸散スポットが僅かに重なるようにす る。これにより、被加工ガラス板11の極表面に加工目 的の形状に沿って、幅数十μm、深さ数μmの溝12が 形成され(図5(b)参照)、スクライビングが施され る。

【0033】次に、CO: レーザ光L: による割断の工 程は、COェレーザ光し。を、集光レンズ系7の集光レ ンズ73bを通じて被加工ガラス板11の表面における 溝12が形成されている部位に集光させ(集光スポット 径;約100μm)、この部位に熱歪みsを加える(図 5 (c)参照)。これにより、溝12に沿って厚さ方向 に割れ13が入り、この部位から割断される(図5 (d) 参照)。これと同時に、Y方向走査フレーム5及 びX方向走査ステージ6を適宜移動させて、CO2 レー ザ光L2 の集光点を、溝12に沿って走査させる。これ により、被加工ガラス板11を加工目的の形状に割断す ることができる。

【0034】上述の実施例によれば、UVレーザ光によ るスクライビングであるので、曲線を含む複雑な形状で も、他の部位にクラック等を入れることなく正確に、か つ、容易・迅速にスクライビングを施すことができ、し かも、そのスクライビングの際には、ガラス体を昇華さ せ、蒸発・飛散させるので、削り屑のような、後の製造 工程等で障害となる可能性のある塵等を発生させること がない。加えて、熱歪を加える工程も、赤外線領域のレ ーザ光を照射することにより行うので、スクライビング を施した部位に正確に沿って熱歪を加えることができ、 他の部位に有害な応力等を加わることがない。従って、 割断の際に割れや欠け等を生ずるおそれがなく、高い歩 留まりで割断を行うことができる。

【0035】なお、上述の一実施例では、UVレーザ光 として、Nd:YAGレーザの第4高調波光を用いた例 をかかげたが、UVレーザ光としては、Nd:YAGレ ーザの第3高調波光(波長;355nm)、エキシマレ ーザ (ArF; 193nm、KrF; 248nm、Xe C1;308nm、XeF;351nm、)、窒素レー ザ(331 nm) 等を用いることもできる。

【0036】また、加工対象のガラスとしては、石英ガ ラス以外のガラス、例えば、無アルカリガラス(組成 例:SIO2;49%、A12O3;10%、B \* O \* ; 15%、ZnO; 25%)、中性ホウケイ酸ガ を集光レンズ系7の集光レンズ73aを通じて被加工ガ 50 ラス(組成例:Si〇z ; 7 2 %、Alz Os ; 5 %、

9

【0037】さらに、上述の一実施例では、レーザ光の 走査方法として、XYステージによる走査の例をかかげ たが、これは、例えば、周知のガルパノメータスキャナ 一等を用いることもできる。

### [0038]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明にかかるガラス加工方法及びその装置は、被加工ガラス体に対して高い吸収率を有する紫外線領域のレーザ光を被加工ガラス体の表面部に集光してその集光点を加工目的の形状に沿って走査させることにより、該被加工ガラス体の表面部にスクライビングを施した後、このスクライビングを施した部位に沿って前記被加工ガラス体に対して高い吸収率を有する赤外線領域のレーザ光を照射して該部位に割断に結び付く熱歪みを与えることにより割断するよう

にしたもので、これにより、被加工ガラス体を、塵等の 発生を押さえつつ容易・迅速に複雑な形状に割断するこ とを可能にしたものである。

10

### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の一実施例にかかるガラス加工装置の 斜視図である。

【図2】集光光学系の縦(Y2平面で切断した)断面図である。

【図3】集光光学系の横(XZ平面で切断した)断面図 10 である。

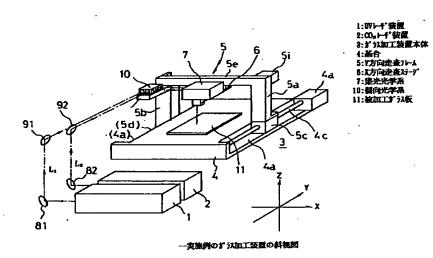
【図4】偏向光学系の水平(XY平面で切断した)断面 図である。

【図 5】 一実施例のガラス加工方法の工程説明図である。

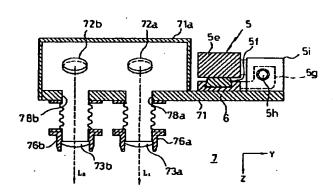
### 【符号の説明】

1…UVレーザ装置、2…CO₂ レーザ装置、3…ガラス加工装置本体、5…Y方向走査フレーム、6…X方向走査ステージ、7…集光光学系、10…偏向光学系、11…被加工ガラス板。

### 【図1】

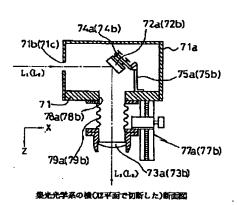


【図2】

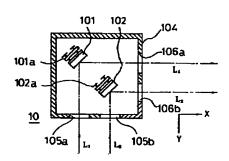


集定定学系の数(パ平面で切断した)断面図



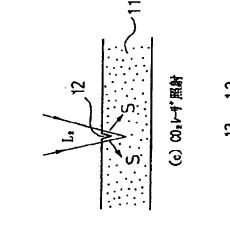


【図4】



偏向光学系の水平(XY平面で切断した)新面図

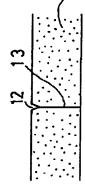
[図5]



ۻ

ď.

## (d) 薄板が ひの割断



(b) x9741° x470.

# 一実施例のボラス加工方法の工程説明図

### <del>--</del>190---

(a) UV1-+・照射